

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des  
irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: 13

Type: **Non spécifié**

## Détecteurs diamant

*jeudi 16 juin 2016 10:30 (30 minutes)*

**Orateur:** M. POMORSKI, Michal (CEA Saclay)